Docket No. 1232-5264

AND TRADEMARK OFFICE IE UNITED STATES PATENT

Applicant(s):

SAIGUSA, et al.

Group Art Unit:

TBA

Serial No.:

10/766,461

Examiner:

TBA

Filed: For:

January 27, 2004

SOLID STATE IMAGE PICKUP DEVICE

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(a))

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I hereby certify that the attached:

- Claim to Convention Priority w/1 document
- Certificate of Mailing 2.
- Return postcard receipt

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

> Respectfully submitted, MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: April 7, 2004

By:

Helen Tiger

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P. 345 Park Avenue New York, NY 10154-0053 (212) 758-4800 Telephone (212) 751-6849 Facsimile



And hicant(s):

SAIGUSA, et al.

Group Art Unit:

TBA

Serial No.:

10/766,461

Examiner:

TBA

Filed:

January 27, 2004

For:

SOLID STATE IMAGE PICKUP DEVICE

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in:

Japan

In the name of:

Canon Kabushiki Kaisha

Serial No(s):

2003-157516

Filing Date(s):

June 3, 2003

Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.

A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. _____, filed _____.

Respectfully submitted,

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: April **7**, 2004

By:

Joseph A. Calvaruso

Registration No. 28,287

Correspondence Address: MORGAN & FINNEGAN, L.L.P. 345 Park Avenue New York, NY 10154-0053 (212) 758-4800 Telephone (212) 751-6849 Facsimile

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 6月 3日

出 願 番 号

特願2003-157516

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-157516]

出 願 人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

2004年 1月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

253434

【提出日】

平成15年 6月 3日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01L 27/00

【発明の名称】

固体撮像装置

【請求項の数】

1

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

三枝 昭夫

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

清水 英

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】

100075948

【弁理士】

【氏名又は名称】 日比谷 征彦

【電話番号】

03-3852-3111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013365

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703876

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 固体撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像を光学的に読み取り電気的な画像信号に変換する撮像手段と、該撮像手段のスミア基準量を記憶する記憶手段と、前記撮像手段の受光量に比例した物理量を前記撮像手段の画像信号出力に基づいて算出する第1の演算手段と、該第1の演算手段の出力と前記記憶手段の出力に基づいてスミア補正データを算出する第2の演算手段と、前記撮像手段が前記画像を読み取って得られる画像信号を前記スミア補正データを用いて補正する補正手段とを備えたことを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像を光学的に読み取り、デジタル化する固体撮像装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、数多くの画像読取装置が開発されており、医療分野においても電子ファイリングや遠隔診断、コンピュータによる診断支援等を行うために、医用画像、特にX線フィルム画像を検出してデジタル化する装置が開発されている。

[0003]

このような画像読取装置は、ハロゲンランプ、蛍光ランプ等の光源から X線フィルムに光を照射し、X線フィルムからの透過光を、例えば C C D リニアセンサ 等の固体撮像素子により受光し、X線フィルムを走査することにより画像データを得ている。

[0004]

固体撮像素子として用いられるCCDには、光電変換部で発生した電荷又は入射光の一部が転送部に漏れ込むことにより、光電変換出力レベルが上昇するスミ

アと呼ばれる現象が生ずる場合がある。スミアはCCDリニアセンサに強い光が 入射した際に発生し、このスミアが発生すると、転送部上の全ての読取画素の光 電変換出力レベルが上昇する。

[0005]

例えば、図5に示すような高濃度部の一部に低濃度部があるフィルムを図示の 走査方向に走査して読み取った場合に、低濃度部から入射した光によりスミアが 発生し、図6に示すように低濃度部の左右のレベルが変動してしまうという問題 点がある。

[0006]

従来ではこのスミアを低減するために、固体撮像素子のチップ上にマスクを設けて、入射光の一部が転送部に漏れ込むことを防止したり、光電変換部と転送部との距離を離すなどの対策により、光電変換部で発生した電荷が転送部に漏れ込むことを防止している。

[0007]

また、固体撮像素子の出力を用いて電気的に補正する方法も知られており、図 7はスミア除去を行うための画像読取装置のスミア補正回路を示している。この スミア補正回路は、CCDから成る固体撮像素子1、A/D変換器2、メモリ3、タイミング発生回路4、減算器5により構成されている。

[0008]

メモリ3はA/D変換器2でA/D変換された画素信号を一時的に記憶しておくためのものであり、記録信号が与えられると入力信号を書き込み、書き込まれた信号を保持して出力する。また、タイミング発生回路4は固体撮像素子1の駆動タイミング及びメモリ3への書き込みタイミングの制御を行う。減算器5はA/D変換器2が出力する画素信号から、メモリ3の出力を減算する。

[0009]

図8に示すように、固体撮像素子1は光電変換素子6、光電変換部で発生した 電荷を転送する転送レジスタ7、転送された電荷を増幅して電圧値に変換するア ンプ8により構成され、フィルムからの透過光を受光する撮像領域と、光電変換 素子6を遮光した光学的黒領域と、光電変換素子6が存在しないダミー領域とを

3/

有している。

[0010]

先ず、フィルムからの透過光が固体撮像素子1に結像されると、光電変換素子6で発生した電荷は、転送レジスタ7に読み出された後に、矢印方向に転送される。転送レジスタ7により転送された電荷はアンプ8により増幅され、電圧値として順次に出力される。フィルムを走査しながらこの動作を繰り返すことにより、フィルム全体の画像信号が得ることができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

固体撮像素子1に強い光が入射した場合には、スミアにより固体撮像素子1の 出力電圧が一定のレベルで増加するが、ダミー領域に相当する画素には、固体撮 像素子1に入射した光により発生した電荷は存在しないため、スミア成分のみが 発生することになる。従って、ダミー領域に相当する画素の信号を、撮像領域の 画素信号から減算することにより、スミアが除去された画素信号を得ることがで きる。

[0012]

図9は図7の画像読取装置における該動作のタイミングチャート図を示している。図9(a)に示す水平同期信号HDに同期して、固体撮像素子1から画素信号が図9(b)に示すように出力される。また、図9(c)に示すように、固体撮像素子1のダミー領域に相当する期間だけ、メモリ3にデータが書き込まれる。メモリ3に書き込まれたダミー信号はそのまま減算器5に出力され、この減算器5により撮像領域の画素信号から減算される。このような動作により、スミアが除去された画素信号を得ることができる。

[0013]

特許文献1には、光電変換素子のない複数のダミー画素又はメモリに光学的黒 画素の加算平均出力を保持し、このメモリに保持された信号を固体撮像素子の画 素信号から減算することにより、スミアの除去を行う方法が開示されている。

[0014]

【特許文献1】

特開2000-50165号公報

[0015]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上述の従来例においては、固体撮像素子のチップ上にマスクを設ける方法では、マスクを設定するためのプロセスが必要なため、製造工程が煩雑になるという欠点がある。また、光電変換部と転送部との距離を離す方法では、完全にスミアを除去することは困難であると共に、チップの面積が大型化するため、固体撮像素子のコストが上昇してしまうという欠点がある。

[0016]

また、ダミー画素信号や光学的黒画素信号を固体撮像素子の画素信号から減算する方法では、ダミー画素、光学的黒画素の数が数画素〜数10画素と制限されているため、加算平均出力を用いたとしてもスミア以外のノイズ、例えば暗電流やランダムノイズ等の影響が除去しきれず、画像上に筋状のノイズが発生してしまうという問題点がある。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

本発明の目的は、上述の問題を解決し、固体撮像素子でスミアが発生した場合でも、正確にスミアを補正処理できる固体撮像装置を提供することにある。

[0018]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明に係る固体撮像装置は、画像を光学的に読み取り電気的な画像信号に変換する撮像手段と、該撮像手段のスミア基準量を記憶する記憶手段と、前記撮像手段の受光量に比例した物理量を前記撮像手段の画像信号出力に基づいて算出する第1の演算手段と、該第1の演算手段の出力と前記記憶手段の出力に基づいてスミア補正データを算出する第2の演算手段と、前記撮像手段が前記画像を読み取って得られる画像信号を前記スミア補正データを用いて補正する補正手段とを備えたことを特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】

本発明を図1~図4に図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。

図1は第1の実施の形態におけるX線フィルム画像読取装置のシェーディング

補正回路の構成図を示している。蛍光ランプ、ハロゲンランプ等から成る光源11の前方には、読取対象であるX線フィルム12、光学系レンズ13、CCDリニアセンサ14が順次に配列されており、CCDリニアセンサ14の出力はアンプ15を介してA/D変換器16に接続されている。A/D変換器16の出力はスミア補正回路17、暗分布補正回路18、対数変換ルックアップテーブル19、明分布補正回路20、シェーディング補正後のデータを記憶するメモリ21に順次に接続されている。

[0020]

更に、スミア補正回路17、暗分布補正回路18、対数変換ルックアップテーブル19、明分布補正回路20、メモリ21には、アドレス、データ、制御信号等を伝送するバスライン22を介して、CPU等により構成される制御回路23、本装置を動作させるためのプログラム等を格納しているRAM、ROM、HD等の記憶媒体24が接続されている。

[0021]

スミア補正回路17は受光量演算回路17a、受光量演算結果保持回路17b、スミア基準量保持回路17c、乗算器17d、CCDリニアセンサ14の1ライン分の画素データを記憶することが可能な1H遅延回路17e、減算器17fにより構成されている。

[0022]

また、暗分布補正回路18は減算器18a、CCDリニアセンサ14のライン数と同等の容量を有する暗分布メモリ18bにより構成され、明分布補正回路20は減算器20a、CCDリニアセンサ14のライン数と同等の容量を有する明分布メモリ20bにより構成されている。

[0023]

シェーディング補正処理は、図2に示すフローチャート図の前処理1と、図3に示すフローチャート図の前処理2と、図4に示すフローチャート図の本処理により行われる。前処理1では、スミア補正用データの記憶・演算及びメモリ21への格納を行い、前処理2では暗分布及び明分布補正用データの記憶・演算及びメモリ21への格納を行う。本処理では、読取対象であるX線フィルム12を読

み取り、前処理1、2において格納したデータに基づいて実際の補正処理を行う。

[0024]

先ず、X線フィルム12を読み取る前の前処理1においては、図2のステップS1で、点灯制御回路により光源11を消灯した後に、ステップS2においてCDリニアセンサ14の出力から暗時の光学的黒画素データを取得する。続いて、ステップS3において光源11を点灯し、ステップS4においてCCDリニアセンサ14の出力から明時の光学的黒画素データ及び明時の撮像領域の画素データを取得する。

[0025]

続いてステップS5において、ステップS2及びステップS4で取得したデータからスミア基準量を算出した後に、ステップS6においてステップS5で算出したスミア基準量をスミア補正回路17に格納する。

[0026]

前処理2においては、先ず図3のステップS11において、点灯制御回路により光源11を消灯した後に、ステップS12において、CCDリニアセンサ14の出力から暗時の撮像領域の画素データを取得する。ステップS13において、ステップS12で取得した暗分布補正用データを暗分布メモリ18bに格納する。ステップS14で点灯制御回路により光源11を点灯した後に、ステップS15においてCCDリニアセンサ14の出力から明時の撮像領域の画素データを取得する。続いて、ステップS16においてステップS15で取得したデータから明分布補正データを算出する。ステップS17では、ステップS16で算出した明分布補正用データを明分布メモリ20bに格納する。なお、上述の前処理1及び、前処理2はX線フィルム12の読み取り毎に行う必要はなく、光源11の光量が変化したときのみ行ってもよい。

[0027]

次に、実際のX線フィルム12を読み取る際の本処理においては、先ず図4のステップS21において光源11を点灯した後に、ステップS22において図示しない搬送手段でX線フィルム12を搬送し、読み取りを開始する。ステップS

23において、CCDリニアセンサ14からのA/D出力をスミア補正回路17 の1H遅延回路17e及び、受光量演算回路17aに入力する。

[0028]

ステップS24では、CCDリニアセンサ1ライン分の読み取りが終了したか否かを判定し、1ライン分の読み取り終了まで、ステップS23の処理を繰り返す。ステップS25では受光量演算結果を読み出し、受光量演算結果保持回路17bに演算結果を格納する。ステップS26では、ステップS25で格納した受光量演算結果と、前処理1のステップS6で算出したスミア基準量を用いてスミア補正データを算出する。

[0029]

続いてステップS27では、次のラインの受光量を計算するために受光量演算 回路17aのリセットを行う。ステップS28では1H遅延回路17eから画像 データを読み出す。ステップS29においては、ステップS28で読み出した画 像データからステップS26で算出したスミア補正データを用いて補正を行う。

[0030]

続いて、ステップS30においては、ステップS29でスミア補正された画像データから、前処理2のステップS13で格納した暗分布補正データを減算する。ステップS31においては、ステップS30で黒補正された画像データを対数変換ルックアップテーブル19において対数変換する。ステップS32においては、前処理2のステップS17で格納した明布補正データからステップS31で対数変換された画像データを減算する。

[0031]

また、ステップS33においては、ステップS32で白補正された画像データをメモリ21に格納した後に、ステップS34においては、1H遅延回路17eに入力された1ライン分の読み取りが終了したか否かを判定し、1ライン分の読み取り終了まで、ステップS28~ステップS34の工程を繰り返す。

[0032]

そして、ステップS35においては、X線フィルム12の読み取りが終了した か否かを判定し、読取終了までステップS23~ステップS34の処理を繰り返 すことにより、1枚のX線フィルム画像を得る。なお、ステップS23~ステップS24及びステップS28~ステップS34の処理を並列に行えば、処理時間を短縮することが可能である。

[0033]

X線フィルム12を読み取る前の前処理1では、スミア基準量を算出する方法として、光学的黒画素の出力値を用いる方法を例に説明し、次に受光量に比例した物理量を算出する方法として、撮像領域画素出力の積和値を算出する方法を例に説明する。

[0034]

光源11を消灯すると、CCDリニアセンサ14は暗時の光学的黒画素及び撮像領域画素出力を電圧値として出力する。CCDリニアセンサ14の出力はアンプ15により増幅されて、図示しないノイズ低減回路(CDS)によりノイズ低減された後に、A/D変換器16に入力される。この電圧はA/D変換器16によりnビットの光学的黒画素のデジタルデータCi($1 \le i \le q$ qは光学的黒の画素数)に変換される。

[0035]

この光学的黒画素のデジタルデータCiは、スミア補正、暗分布補正、対数変換及び明分布補正処理を行わずに、メモリ21に記憶され、このメモリ21に記憶された光学的黒画素のデジタルデータCiから、次式(1)に基づいて平均値Cを算出する。ただし、qは光学的黒画素の画素数である。

$$C = (1/N) \Sigma C i (i = 1 \rightarrow N) ; 1 \le N \le q \cdot \cdot \cdot (1)$$

[0036]

式(1)では、平均値Cの算出に暗時の光学的黒画素出力を用いたが、光学的 黒画素出力の代りに、暗時の撮像領域の画素出力を用いてもよい。

[0037]

上述の説明では、平均値Cの演算に1ライン分の光学的黒画素データCiを用いたが、更にS/Nを上げるために複数ラインの光学的黒画素データCiを記憶して、演算を行ってもよい。

[0038]

上述の暗時光学的黒画素出力の取得動作と同様に、明時の光学的黒画素出力の 平均値C'を次式(2)により算出する。

C' =
$$(1/N) \Sigma C i$$
' $(i = 1 \rightarrow N)$; $1 \le N \le q \cdot \cdot \cdot (2)$
[0040]

上述の説明では、平均値C'の演算に1ライン分の光学的黒画素データCi'を用いたが、更にS/Nを上げるために複数ラインの光学的黒画素データCi'を記憶して、演算を行ってもよい。

[0041]

式(1)、(2)から算出した平均値C及びC'を用いて、次式(3)により スミアの発生量Smax を算出する。

$$S \max = C' - C \qquad \cdot \cdot \cdot (3)$$

[0042]

なお本実施の形態においては、スミア発生量を光学的黒画素出力に基づいて算出しているが、この方法に限らずダミー画素出力に基づいてスミア発生量を算出してもよく、その場合にはダミー画素出力値又はダミー画素出力値の平均値がスミア発生量に相当する。

次に、明時の撮像領域画素のデジタルデータLiから、積和値Lsum を次式(4)に基づいて算出する。ただし、pは撮像領域の画素数である。

Lsum
$$= \Sigma L i$$
 $(i = 1 \rightarrow p) \cdot \cdot \cdot (4)$

[0044]

なお、本実施の形態においては全撮像領域の画素を演算対象としたが、光が入 射しない、或いは光の入射が少ない画素については演算対象としなくともよい。

[0045]

式(3)、(4)から算出したスミアの発生量Smax 及び明時の撮像領域画素の積和値Lsum を用いて、次式(5)によりスミア基準量Sref を算出する。

$$Sref = Smax / Lsum \cdot \cdot \cdot (5)$$

[0046]

以上の処理により取得したスミア基準量 S ref を,スミア補正回路 1 7 のスミア基準量保持回路 1 7 c に記憶する。なお、受光量に比例した物理量として積和値を用いているが、これに限らず平均値等の受光量に比例した物理量であればよい。このようにして、前処理 1 は終了する。

[0047]

次に、前処理 2 において、光源 1 1 を消灯すると、CCDリニアセンサ 1 4 は暗時の光学的黒画素及び撮像領域画素出力を電圧値として出力する。CCDリニアセンサ 1 4 の出力はアンプ 1 5 により増幅されて、ノイズ低減回路によりノイズ低減された後にA/D変換器 1 6 に入力される。この電圧はA/D変換器 1 6 により n ビットの撮像領域画素のデジタルデータ B i ($1 \le i \le p$) に変換される。

[0048]

デジタルデータに変換された撮像領域画素 B i は、スミア補正、暗分布補正、 対数変換及び明分布補正処理を行わずにメモリ 2 1 に記憶される。メモリ 2 1 に 記憶された撮像領域画素のデジタルデータ B i を、暗分布補正データとして暗分 布補正回路の暗分布メモリ 1 8 b に記憶する。

$[0\ 0\ 4\ 9]$

また、ランダムノイズ等の影響を低減するために、複数ラインの撮像領域画素のデジタルデータBij($1 \le i \le p$ pは撮像領域の画素数、 $1 \le j \le N$ N は収集ライン数)を取得し、次式(6)により複数のラインの平均値とした暗分布補正データBi'を暗分布メモリ18bに記憶してもよい。

Bi' =
$$(1/N)$$
 Σ Bij $(j = 1 \rightarrow N)$ $\cdot \cdot \cdot (6)$

[0050]

[0051]

L i" = [A · l o g₁₀{L i - (B i + Smax) + 1}] (1 \leq i \leq p) · (7)

[0052]

このような処理により取得した明分布補正用データLi"を、明分布補正回路20の明分布補正メモリ20bに格納する。

[0053]

また暗分布補正データ同様に、ランダムノイズ等の影響を低減するために、複数ラインの撮像領域画素のデジタルデータLij($1 \le i \le p$ pは撮像領域の画素数、 $1 \le j \le N$ Nは収集ライン数)を取得し、次式(8)により複数のラインの平均値とした明分布データLi'を明分布補正用データLiの代りに式(7)に用いて、明分布補正用データLi"を算出してもよい。以上で、前処理2は終了する。

L i' =
$$(1/N) \Sigma L i j$$
 $(j = 1 \rightarrow N) \cdot \cdot \cdot (8)$
[0054]

実際にX線フィルム12を読み取る際の本処理において、光源11を点灯すると、光源11からの光はX線フィルム12を透過し光学系レンズ13により集光し、CCDリニアセンサ14上に結像される。X線フィルム12は図示しない搬送手段により順次矢印の方向に搬送されるため、CCDリニアセンサ14は搬送

方向と直交する方向の一次元像を受光することにより、X線フィルム12はCC Dリニアセンサ14により走査されて全画像が読み込まれる。

[0055]

CCDリニアセンサ14で受光された光は光電変換され、1 画素ずつ電圧値として出力される。CCDリニアセンサ14 の出力はアンプ15 により増幅され、ノイズ低減回路によりノイズ低減された後にA/D変換器16 に入力される。この電圧はA/D変換器16 によりn ビットのデジタルデータD i($1 \le i \le p$)に変換される。

[0056]

スミア補正回路17では、CCDリニアセンサ14の出力Diを受光量演算回路17a及び1H遅延回路17eに入力する。受光量演算回路17aでは、入力された画像データから受光量に比例した物理量として、積和値Dsumを次式(9)により算出する。ただし、pは撮像領域の画素数である。

$$D_{SUM} = (1/N) \Sigma L i \qquad (i = 1 \rightarrow p) \cdot \cdot \cdot (9)$$

[0057]

なお、受光量に比例した物理量として積和値Dsum を用いているが、これに限らず平均値等の受光量に比例した物理量であってもよい。

[0058]

1ライン分の画像データの入力が終了すると、受光量演算回路17aにより算出された受光量演算結果Dsumが、受光量演算結果保持回路17bに入力され保持される。受光量演算結果が受光量演算結果保持回路17bに入力された時点で、受光量演算回路17aは次のラインの演算のためにリセットされる。

次に、スミア基準量保持回路17cの出力するスミア基準量Sref 及び受光量 演算結果保持回路17bが出力する受光量演算結果Dsum は、乗算器17dに入 力されて、次式(10)の乗算が実行されスミア補正データSが出力される。

$$S = Dsum \cdot Sref \cdot \cdot \cdot (10)$$

[0060]

以上の処理により、1H遅延回路17eに入力された画像データDi中に含ま

れるスミア発生量Sが算出される。算出されたスミア発生量Sを用いて、1H遅延回路17eから画像データDiを読み出し、次式(11)の減算を実行することにより、スミア補正後のデータDi'が得られ、このデータDi'は暗分布補正回路18に出力される。

$$D~i~' = D~i - S~\cdot~\cdot~(1~1)$$

[0061]

暗分布補正回路18では、スミア補正回路17の出力の各画素から、減算器18aによる前処理2により予め取得した暗分布補正用データBiを減ずる。黒補正回路の出力をDi"とすると、暗分布補正回路18の出力は、次式(12)となる。

D i " = D i ' - B i
$$(1 \le i \le p) \cdot \cdot \cdot (12)$$
[0 0 6 2]

暗分布補正回路 180 出力は除算を行うための対数変換ルックアップテーブル 19 に入力される。対数変換ルックアップテーブル 19 は n ビット入力、n ビット出力であり、対数変換ルックアップテーブル 190 出力を 12 とすると、次式 13 となる。ただし、12 となる。ただし、12 となる。

$$Y i = \{A \cdot l \circ g_{10} (D i'' + 1)\}$$
 $(1 \le i \le p) \cdot \cdot \cdot (13)$
 $\{0 \ 0 \ 6 \ 3\}$

明分布補正回路 20 では、減算器 20 a により前処理により予め記憶した明分布補正用データ L i"の対応する画素から、対数変換ルックアップテーブル 19 の出力 Y i を減ずる。従って、減算器 20 a で行われる減算によって、X 線フィルム 12 の透過率を計算する除算が実行される。この出力は対数値であるため濃度出力 2 なる。濃度出力 2 i は次の式(14)から得られ、メモリ 2 1 に記憶される。

$$Z i = L i " - Y i (1 \le i \le p) \cdot \cdot \cdot (1 4)$$
[0 0 6 4]

上記の処理を行い、1 H遅延回路17 e に保持されている1ライン分の画像データを読み出し、スミア補正及びシェーディング補正処理を行った後に、次のラインのCCDリニアセンサ14の出力の積和演算回路17 a 及び1 H遅延回路1

7 eへの入力を開始する。

[0065]

また、処理時間短縮のために1日遅延回路17eからの読み出しと平行して、 次のラインの書き込みを開始してもよい。フィルム12の読み取りが終了するま で、以上の処理を繰り返すことにより、1枚のX線フィルム12の画像データが 得られる。このようにして、実際にX線フィルム12を読み取る際のスミア補正 及びシェーディング補正処理が行われる。

[0066]

なお上述の実施例では、モノクロの1ラインの光電変換素子を有する固体撮像素子であるCCDリニアセンサ14を用いて説明を行ったが、例えばカラーのRGB3ラインの光電変換素子を有する固体撮像素子においても、ライン毎に上述の処理を行うことにより、スミア補正処理は可能である。

[0067]

また上述の実施例では、1 H遅延回路 1 7 e を用いて説明を行ったが、1 Hである必要はなく、1 H以上の遅延回路を設け、スミア基準量及び画像データをメモリ上に取得した後に、画像データから受光量に比例した物理量を算出して、スミア補正処理を行ってもよい。例えば、接続した P C (パーソナルコンピュータ)上でシェーディング補正処理などを行う画像読取装置においては、一旦、画像データを P C に送った後に、画像データから受光量に比例した物理量を算出して、スミア補正処理及びシェーディング補正処理を行うことができる。

[0068]

また、複数ラインの光電変換素子を有するCCDリニアセンサを用い、各ライン間のギャップによる時間差を利用して、実際の読取ラインよりも先行するラインの出力する受光量に比例した物理量を算出して、スミア補正に用いることもできる。これにより、1 H遅延回路の代りに、ライン間のギャップ分を補う受光量に比例した物理量を保持する回路によりスミア補正が可能であるため、回路を簡素化することが可能である。

[0069]

本実施の形態によれば、画像信号の受光量に比例した物理量に基づいて、スミ

ア補正データを算出する構成とすることにより、スミア以外の暗電流やランダム ノイズ等の影響を受けることなく、正確にスミア補正処理を行うことができる。

[0070]

本発明に係るプログラムを格納した記録媒体24を他のシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータが、記録媒体24に格納されたプログラムコードを読み出し、実行するようにしてもよい。

[0071]

なお、本発明の実施の形態の幾つかを、次に列挙する。

[0072]

[実施の形態1] 画像を光学的に読み取り電気的な画像信号に変換する撮像手段と、該撮像手段のスミア基準量を記憶する記憶手段と、前記撮像手段の受光量に比例した物理量を前記撮像手段の画像信号出力に基づいて算出する第1の演算手段と、該第1の演算手段の出力と前記記憶手段の出力に基づいてスミア補正データを算出する第2の演算手段と、前記撮像手段が前記画像を読み取って得られる画像信号を前記スミア補正データを用いて補正する補正手段とを備えたことを特徴とする固体撮像装置。

[0073]

[実施の形態 2] 前記スミア基準量は光源を点灯した時に発生するスミア発生量及び受光量に比例した物理量に基づいて算出したものであることを特徴とする実施の形態 1 に記載の固体撮像装置。

[0074]

[実施の形態3] 前記スミア基準量は光源を点灯した時に発生するスミア発生量を、受光量に比例した物理量で除したものであることを特徴とする実施の形態1に記載の固体撮像装置。

[0075]

[実施の形態4] 前記スミア発生量は前記光源を点灯して記憶したダミー画素出力値であることを特徴とする実施の形態2又は3に記載の固体撮像装置。

[0076]

[実施の形態5] 前記スミア発生量は前記光源を点灯して記憶したダミー画

素出力値の平均値であることを特徴とする実施の形態2又は3に記載の固体撮像装置。

[0077]

[実施の形態 6] 前記スミア発生量は前記光源を点灯して記憶した光学的黒画素出力値から、前記光源を消灯して記憶した光学的黒画素出力値又は撮像領域画素出力値を差し引いたものであることを特徴とする実施の形態 2 又は 3 に記載の固体撮像装置。

[0078]

[実施の形態 7] 前記スミア発生量は前記光源を点灯して記憶した光学的黒画素出力値の平均値から、前記光源を消灯して記憶した光学的黒画素出力値の平均値又は撮像領域画素出力値の平均値を差し引いたものであることを特徴とする 実施の形態 2 又は 3 に記載の固体撮像装置。

[0079]

[実施の形態 8] 前記受光量に比例した物理量は、前記撮像手段の撮像領域 画素出力の積和値であることを特徴とする実施の形態 1~3の何れか1つの実施 の形態に記載の固体撮像装置。

[0080]

[実施の形態9] 前記受光量に比例した物理量は、前記撮像手段の撮像領域 画素出力の平均値であることを特徴とする実施の形態1~3の何れか1つの実施 の形態に記載の固体撮像装置。

[0081]

[実施の形態10] 前記スミア補正データは、前記スミア基準量及び前記画像を読み取った際の受光量に比例した物理量に基づいて算出したものであることを特徴とする実施の形態1に記載の固体撮像装置。

[0082]

[実施の形態11] 前記スミア補正データは、前記スミア基準量に前記画像を読み取った際の受光量に比例した物理量を乗じた値であることを特徴とする実施の形態1に記載の固体撮像装置。

[0083]

[実施の形態12] 前記補正手段は前記画像を読み取って得られる画像信号から、前記スミア補正データを減算することを特徴とする実施の形態1に記載の固体撮像装置。

[0084]

[実施の形態13] 前記撮像手段はCCDリニアセンサであることを特徴と する実施の形態1に記載の固体撮像装置。

[0085]

[実施の形態14] 実施の形態1~12に記載のプログラムを格納した記憶媒体。

[0086]

【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る固体撮像装置は、固体撮像素子にスミアが発生した場合でも、スミア以外の暗電流やランダムノイズ等の影響により画像上に筋状のノイズを発生させることなく、正確にスミア補正処理を行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

シェーディング補正回路の構成図である。

【図2】

前処理1のフローチャート図である。

【図3】

前処理2のフローチャート図である。

【図4】

本処理のフローチャート図である。

【図5】

高濃度部の一部に低濃度部があるフィルムの説明図である。

図6】

フィルムを読み取った場合の信号レベルの説明図である。

【図7】

従来例のスミア補正回路の構成図である。

【図8】

固体撮像素子の構成図である。

【図9】

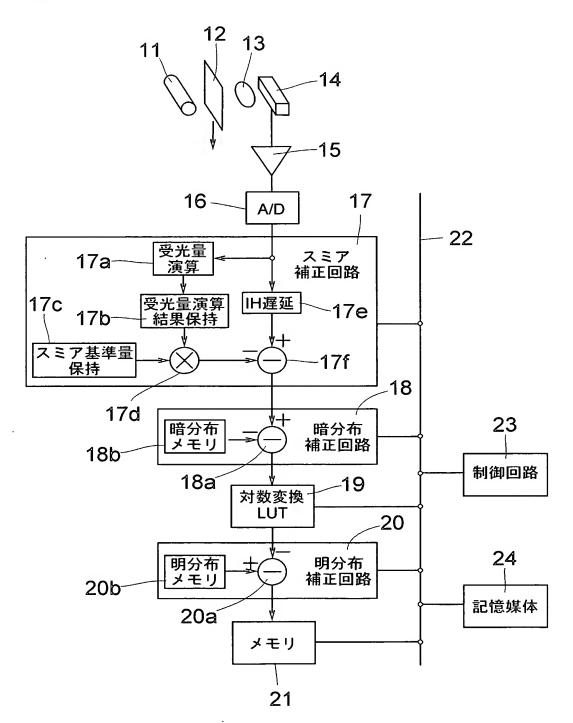
従来例の固体撮像装置の読取動作のタイミングチャート図である。

【符号の説明】

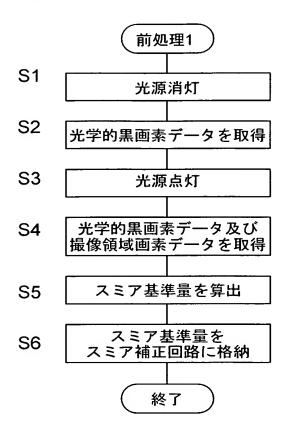
- 11 光源
- 12 X線フィルム
- 14 CCDリニアセンサ
- 16 A/D変換器
- 17 スミア補正回路
- 18 暗分布補正回路
- 19 対数変換ルックアップテーブル
- 20 明分布補正回路
- 21 メモリ
- 23 制御回路
- 24 記憶媒体

【書類名】 図面

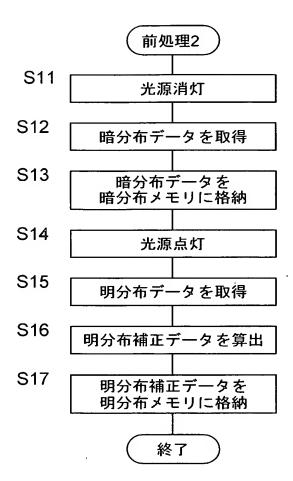
【図1】



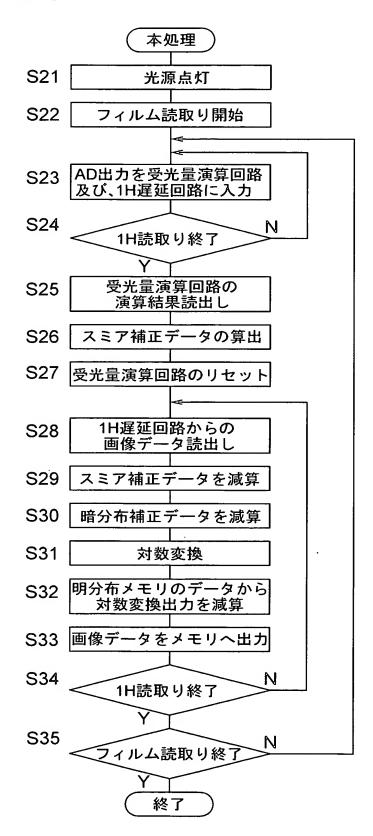




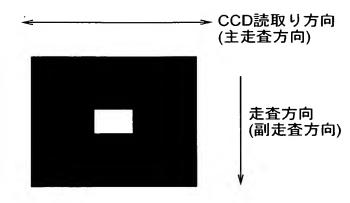
【図3】



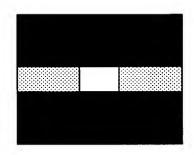
[図4]



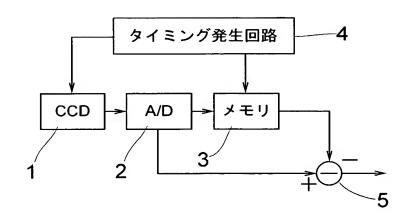
【図5】



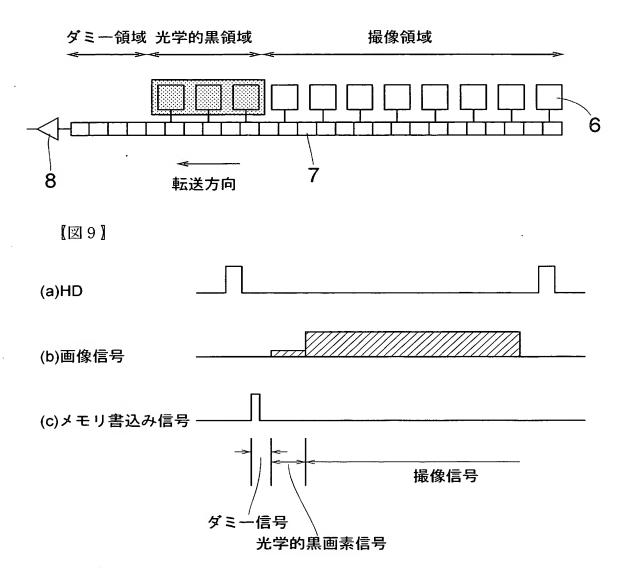
【図6】



【図7】



[図8]



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 CCD等の固体撮像素子を用いた固体撮像装置において、固体撮像素子への入射光強度の変化により変動するスミアを、暗電流やランダムノイズ等の影響を受けることなく、正確に補正する。

【解決手段】 光源11を点灯してX線フィルム12を撮像したときのスミアの発生量及び撮像時のCCDリニアラインセンサ14の受光量に比例した物理量を算出し、撮像時の受光量に比例した物理量と、フィルム12読取時の受光量に比例した物理量の比率から、画像読取時のスミアの発生量を算出して補正処理を行う。

【選択図】 図1

特願2003-157516

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社